

X射线显微分析仪 (μXRF) XGT-9000

应对外来物质分析和元素分布检测的最新解决方案。

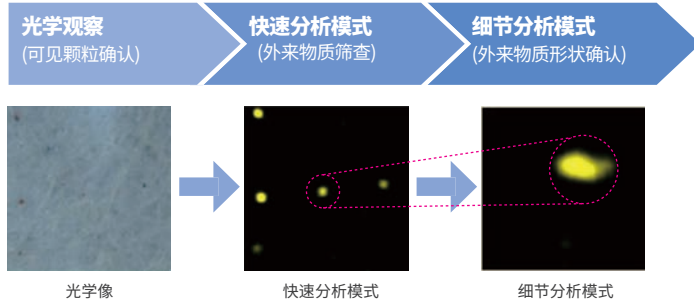
运用强大的“快速分析模式”和“细节分析模式”，对外来物质分析，XGT-9000作为单一一台仪器即能迅速完成筛查和形状确认。



外来物质分析的最新解决方案

快速扫描结合图像处理的颗粒增强技术让外来物质分析非常容易。快速分析模式能够迅速筛查外来物质，细节分析模式进一步确认外来物质的形状。

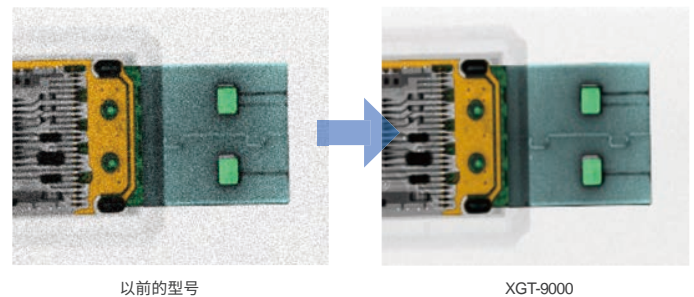
外来物质分析流程



快速、清晰、生动的元素分布成像

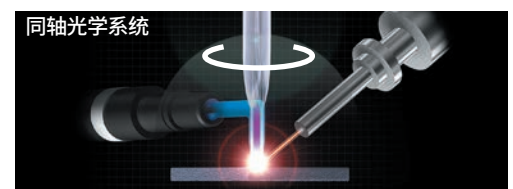
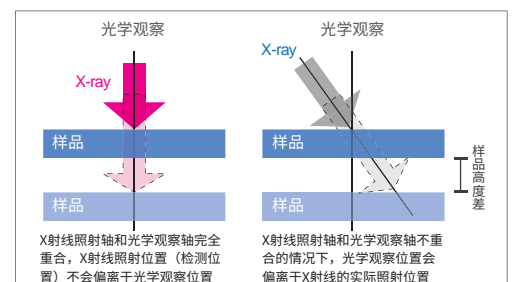
检测时间的缩短和低背景元素分布分析成像大幅减少的总的分析时间。

元素分布分析合成像的比较



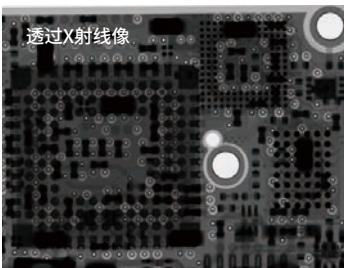
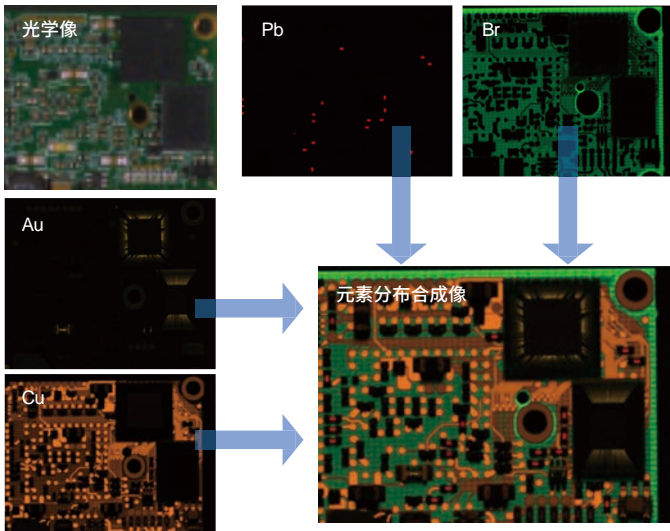
光学观察系统和X射线束独特的同轴设计确实保证了精确的微区分析

最新设计的光学系统具备两种照明方式—环状照明和同轴照明。无论是镜面样品还是凹凸不平的样品，通过这两种照明方式都能进行清晰的观察。细节摄像机可以调整工作焦距，像印刷电路板这样具有很大高度差表面的样品也能清晰地观察。



多种分析模式

丰富的图像处理手段能够帮助获得精确地元素分布信息。通过多重元素分布像的叠加可以轻松获得共存元素及多种元素的分布图像。



XGT-9000 可以同时获得透过 X 射线像和荧光 X 射线像，嵌入的外来物质和集成电路内部线路缺陷可以通过透过 X 射线像清晰地观察。

XGT-9000技术规格

基本参数	
元素分析范围	Na - U
最大样品尺寸 [W x D x H]	300 x 250 x 40 mm
样品台尺寸[W x D x H]	100 x 200 x 20 mm
光学图像	整体图像/细节图像
细节光学图像/X射线照射斑	同轴
X射线管	
管电压	15 kV, 30 kV, 50 kV
管电流	最大1 mA
靶材	Rh
X射线光学系统	
毛细管数	3
检测器	
荧光X射线检测器	无液氮硅漂移检测器 (SDD)
透过X射线检测器	配备
扫描	
扫描范围	100 x 100 mm (最大)
像素	4种规格
光学相机 (细节相机)	
视场区域	2.5 x 2.5 mm
分辨率	< 10 μm
焦距	1 mm- 10 mm
照明	环状、同轴、透过
其它	
真空	样品室真空/光学系统真空

www.horiba.com/cn/scientific
info-sci.cn@horiba.com

北京 北京市海淀区海淀东三街2号欧美汇大厦12层 (100080)
上海 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋一层D单元 (200335)
广州 广州市天河区体育东路138号金利来数码网络大厦1612室 (510620)
成都 成都市青羊区人民南路一段86号城市之心大厦17层C1 (610016)
西安 西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场B栋Win国际2306室

Tel: 010 - 8567 9966 Fax: 010 - 8567 9066
 Tel: 021 - 6289 6060 Fax: 021 - 6289 5553
 Tel: 020 - 3878 1883 Fax: 020 - 3878 1810
 Tel: 028 - 8620 2663
 Tel: 029 - 8886 8480 Fax: 029 - 8886 8481